

## 3108.透過型電子顕微鏡



装置設備名称	透過型電子顕微鏡
メーカー	日本電子(株)
商品名・型式	透過型電子顕微鏡/JEM-2010
性能・仕様	加速電圧200kV 分解能0.194nm (粒子像) 0.14nm (格子像) エネルギー分散型X線分析器付き (ウルトラthinウインドータイプ)
設備概要・用途	結晶性および非晶質材料の微細組織観察、およびその部分の結晶性に関する情報(電子線回折法)を得ると同時に微小部分の元素分析を行う。
対象試料	金属・無機セラミックスなどの固体試料
その他・注意事項	超高真空タイプのため、ガス発生の可能性のある試料は不可